



Libellé	Libellé EN	Marque	Modèle
AFM	AFM	Veeco	D3100
Analyseur de réseau 6GHz	VNA 6GHz	Anritsu	MS4623B
Analyseur de sorption / désorption	Water sorption / desorption kinetics	Surface Measurement Systems	DVS Advantage 1
Analyseur de spectre 3GHz	3GHz Spectrum analyzer	Anritsu	MS2661C
Binoculaire UV	UV binocular microscope	Leica	MZFLIII
Caméra infrarouge	Infrared camera	FLIR	P660
Cathodoluminescence spectrale	Cathodoluminescence detector	Gatan	MonoCL4
Chromatographe en phase liquide	Liquid chromatography	PerkinElmer	
Chromatographe gaz	Gaz Chromatography	PerkinElmer	GC 500
Cisaillage de puce / wire pull	Wire pull / die shear testing machine	Nordson DAGE	BT4000
Décapsuleur chimique	Package opening machine (chemical)	Digit Concept	BG Dcap Delta A21
Détecteur EBSD (métallurgie, cristallographie)	EBSD detector (metallurgy, crystallography)	Oxford Instruments	
Dilatométrie	Dilatometry	Netzsch	DIL 402
DMA	DMA	Netzsch	242C
DSC	DSC	Mettler-Toledo	DSC3+
Etuve à chaud	HTOL chamber	Binder	FED115
Etuve Climatique	THB chamber	Weiss	WK3-270/150LN2
Etuve climatique	THB chamber	Weiss	SD11/300/80-S
Etuve cyclage thermique (-170 / +300°C)	Thermal cycling chambers (-170 / +300°C)	Sun	EC11
Etuve à chaud	HTOL chamber	Binder	FD53
FIB dual beam	Dual Beam FIB	FEI	Quanta 3D
Fluorescence X	X-ray fluorescence system	Niton	XL3T900
Interféromètre	Interferometer	Fogale	Zoom surf 3D
Lock-in ampliflier	Lock-in ampliflier	Stanford Research Systems	SR 510, 560, 830, 850
Lock-in ampliflier	Lock-in ampliflier	Zurich Instruments	MFLI



Libellé	Libellé EN	Marque	Modèle
Machine de traction + étuve	Tensile machine - thermal chamber	MTS Systems	XP & SE-600-3-3
Machine MTS 810	Tensile machine	MTS Systems	318-10
MEB	SEM (High resolution)	Zeiss	ULTRA 55-2
MEB	SEM (Environmental)	Zeiss	SUPRA VP55
MEB	SEM (Analytical)	Hitachi	S3400N
Microscope infrarouge (OBIRCH, EMMI)	IR microscope (OBIRCH, EMMI)	Hamamatsu	PHEMOS 1000
Microscope optique	Optical microscope	Olympus	Provis
Microscope optique	Optical microscope	Olympus	VanoxT
Nanoindenteur	Nanoindenter	MTS Systems	XP
Nanoindenteur	Nanoindenter	MTS Systems	DCM
PIND tester	PIND tester	PTI	4501A
Plasma FIB	Plasma FIB	FEI	Vion
Plasma ICP	ICP plasma	Oxford Instruments / PTS	ICP 65/80+
Polisseur ionique	Precision ion polishing	Gatan	PIPS II
Polisseuse	Sample preparation : polishing system	Allied	
Profilomètre Optique 3D (confocal + interféromètre + focus variation)	Optical profilometer (confocal + focus variation + interferometer)	Sensofar	S-NEOX
Spectromètre EDX	EDS detector	Oxford Instruments	ISIS
Spectromètre EDX	EDS detector	Oxford Instruments	INCA
Station de test sous pointes	Manual probe station	Karl Süss	PM8
Testeur sous pointes environnemental	Environmental probe station	LakeShore	FWPX
Tête thermique	Thermal head	Temptronic	x-stream 4300A-8C32-9
Thermographie lock-in	Lock-in thermography	Sector Technologies	ELITE
TMA	TMA CTE measurement	Netzsch	420
Tomographe X	X-ray CT	GE - Phoenix	v tome xs 240/180